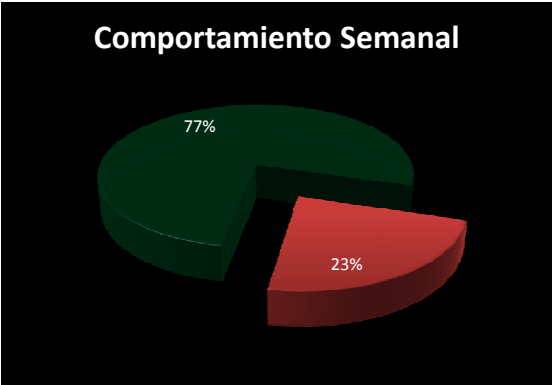
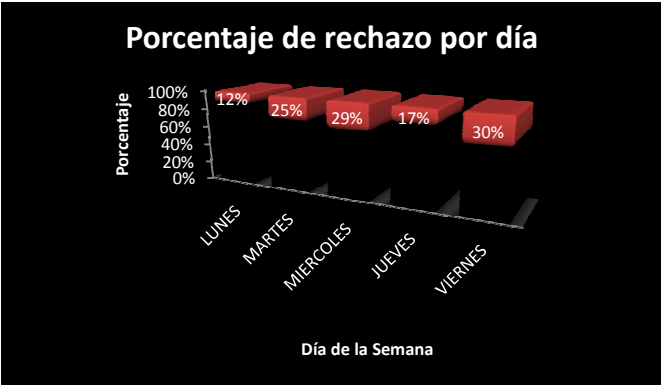
	REVISIÓN: 00	CLAVE: IQFO750102	EMISIÓN: 21/04/08
	REPORTE DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO.		PÁGINAS: 1 DE 1

NOMBRE DEL PROCESO:	NEXTEL		FECHA DE ELABORACION:		08-abr-13	
RESPONSABLE DEL PROCESO	Eunice Mendoza / Gerardo González		PERIODO	01-abr	A	05-abr
OBJETIVO DEL REPORTE	INFORMACIÓN DE HALLAZGOS DE LA NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO					
METODO APLICADO	HISTOGRAMA / PARETO	CRITERIOS:	ESPECIFICACIONES, TABLA DE CRITERIOS COSMETICOS	TIPO DE INSPECCIÓN	MUESTREO	

Histograma:

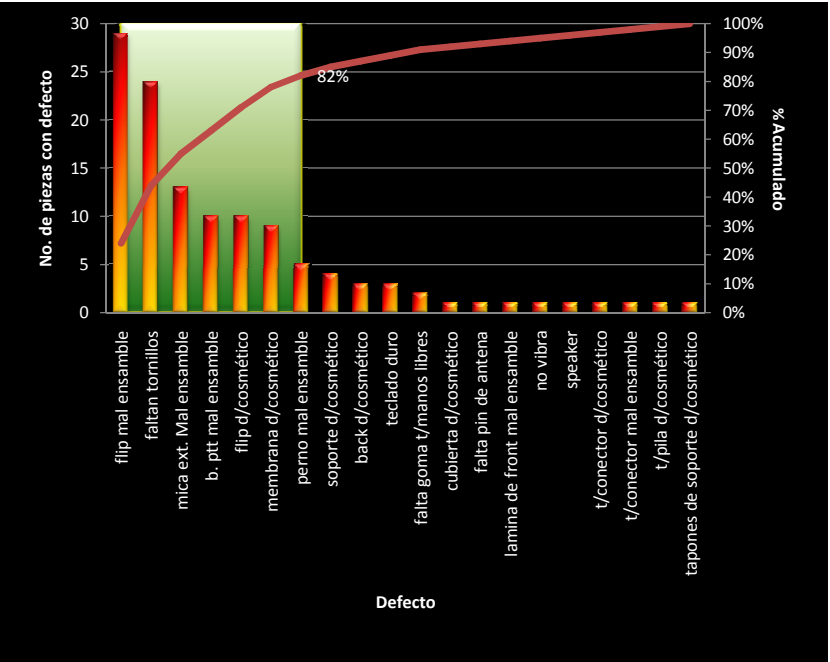
DÍA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
P REVISADAS	51	80	164	162	66	523
P ACEPTADAS	45	60	116	135	46	402
P. RECHAZADAS	6	20	48	27	20	121
%ACEPTADO	88%	75%	71%	83%	70%	77%
% RECHAZO	12%	25%	29%	17%	30%	23%

Gráfico:



Detalle de Principales Defectos:

Defecto	Cantidad	% Acm.
flip mal ensamble	29	24%
faltan tornillos	24	44%
mica ext. Mal ensamble	13	55%
b. ptt mal ensamble	10	63%
flip d/cosmético	10	71%
membrana d/cosmético	9	78%
perno mal ensamble	5	82%
soporte d/cosmético	4	85%
back d/cosmético	3	87%
teclado duro	3	89%
falta goma t/manos libres	2	91%
cubierta d/cosmético	1	92%
falta pin de antena	1	93%
lamina de front mal ensamble	1	94%
no vibra	1	95%
speaker	1	96%
t/conector d/cosmético	1	97%
t/conector mal ensamble	1	98%
t/pila d/cosmético	1	99%
tapones de soporte d/cosmético	1	100%
Total	121	



Observaciones y Recomendaciones:

Es importante trabajar en los primeros 7 defectos ya que si logran eliminarlos, su rechazos bajarían a un 18%